



USŁUGA BADAWCZA

POMIARY DŁUGOŚCI I KĄTA

ZAKRES BADAŃ

Wzorcowanie*:

- wzorców chropowatości za pomocą profilometru stykowego,
- wzorców okrągłości w postaci wałka ze ścięciem (flick standard) za pomocą profilometru stykowego,
- wzorca sferycznego w postaci szklanej półkuli za pomocą przyrządu do pomiarów zarysu kształtu,

Pomiary:

- struktury geometrycznej powierzchni (SGP) za pomocą profilometru stykowego,
- SGP za pomocą nanomaszyny z wykorzystaniem głowic AFM, WLI, FV i stykowej,
- odchyłek geometrycznych za pomocą przyrządu do pomiarów zarysu kształtu,
- 3D za pomocą skanera światła strukturalnego,
- elementów wielkogabarytowych na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM),
- elementów wielkogabarytowych za pomocą laser trackera.

ZASTOSOWANIE

- przemysł lotniczy i motoryzacyjny,
- robotyka (wytworzenie energii oraz w inżynierii lądowej i materiałowej),
- użytkownicy zaawansowanych urządzeń pomiarowych do wykonywania badań w skali nano (mikroskopy AFM, SPM),
- laboratoria badawcze i wzorujące,
- przemysł metalowy i maszynowy, środków transportu, elektrotechniczny, łożyskowy,
- producenci pomp i armatury przemysłowej,
- firmy zajmujące się automatyzacją procesu produkcji,
- producenci maszyn dla przemysłu spożywczego,
- producenci elementów wytwarzanych technologią druku 3D.

ZALETY

Pomiary i wzorcowania wykonywane w ŚKL GUM gwarantują niską wartość niepewności pomiaru oraz zachowanie spójności pomiarowej.

* Badania akredytowane będą realizowane od 2026 r.



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE



Politechnika
Świętokrzyska

KONTAKT FORMALNY
biznes@tu.kielce.pl
tel. 512 970 189

KONTAKT MERYTORYCZNY
interlab_pl@gum.gov.pl
www.kampus.gum.gov.pl



Świętokrzyski
Kampus
Laboratoryjny | Głównego
Urzędu
Miar